特許協力条約

殿

発信人 日本国特許庁(受理官庁)

出願人代理人

須藤 克彦

あて名

〒373-0818

群馬県太田市小舞木町388 OKビル2階

PCT/JP03/15328

RO105

PCT

国際出願番号及び 国際出願日の通知書

(法施行規則第22条、第23条) [PCT規則20.5(c)]

		発送日(日.	月. 年)
			16.12.03
出願人又は代理人			
の書類記号			重 要 な 通 知
国際出願番号	国際出願日(日	月. 年)	優先日(日.月.年)
PCT/JP03/15328	01.	12.03	03.12.02
出願人(氏名又は名称)			
三洋電機株式会社			

1. この国際出願は、上記の国際出願番号及び国際出願日が付与されたことを通知する。

記録原本は、 16日12月03年 に国際事務局に送付した。

注 意

- a. 国際出願番号は、特許協力条約を表示する「PCT」の文字、斜線、受理官庁を表示する 2文字コード(日本の場合JP)、西暦年の最後から2桁の数字、斜線、及び5桁の数字からなっています。
- b. 国際出願日は、「特許協力条約に基づく国際出願に関する法律」第4条第1項の要件を満 たした国際出願に付与されます。
- c. あて名等を変更したときは、速やかにあて名の変更届等を提出して下さい。
- d. 電子計算機による漢字処理のため、漢字の一部を当用漢字、又は、仮名に置き換えて表現 してある場合もありますので御了承下さい。
- e. この通知に記載された出願人のあて名、氏名(名称)に誤りがあるときは申出により訂正 します。
- f. 国際事務局は、受理官庁から記録原本を受領した場合には、出願人にその旨を速やかに通知(様式PCT/IB/301)する。記録原本を優先日から14箇月が満了しても受領していないときは、国際事務局は出願人にその旨を通知する。 [PCT規則22.1(c)]

名称及びあて名

日本国特許庁 (RO/JP)

郵便番号 100-8915 TELO 3-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特許 庁長 官

様式PCT/RO/105 (1998年7月)

特許協力条約に基大国際出願

顧

書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処 理されることを請求する。

国際出願番号	PCT PCT
国際出願日	01.12.03
(受付印)	交領印

理されることを請求する。		
	出顧人又は代理人の各類配号 (分望する場合、最大12字)	
第1欄 発明の名称		
回路レイアウト構造		
第Ⅱ欄 出願人 この棚に記載した者は、発明者でもある。		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あ	て名は郵便番号及び国名も記載)	包括番号:
三洋電機株式会社	<u> </u>	06-6694-3644
SANYO ELECTRIC CO., LTD	■ :	ファクシミリ番号:
〒570-8677 日本国大阪府守口市京阪本通二丁	「目5番5号 [06-6994-3406
5-5, keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi, Osaka 570-8	677	加入包信番号:
Japan	[
Jupun		出願人登録番号:
国籍 (国名): 日本国 JAPAN 住所	新 <i>(国名)</i> : 日本国 JAPAI	N
この欄に配載した者は、次の 指定国についての出顧人である:	くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
第Ⅲ欄 その他の出願人又は発明者		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配験;法人は公式の完全な名称を配載;あ	て名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:
サッチン アガラワル	lı.	出願人のみである。
Sachin Aggarwal 66C, プロックーD, セクター53,	1	mag/(VVIII)
カンチャンジャンガーアパートメンツ		✓ 出願人及び発明者である。
ノイダ (ウッター ブラデシュ) ポストインデックスナンバー: 66C, Block-D, Sector-53,	201303, インド国	発明者のみである。
Kanchanjunga Apartments,		──
NOIDA (UTTAR PRADESH)		
PIN: 201303, India		出顧人登録番号:
国籍(国名): インド国 INDIA 住房	f (国名): インド国 IND	I A
この棚に記載した音は、次の	、すべての指定国 ✓ 米国のみ	追記欄に記載した指定国
その他の出顧人又は発明者が披棄に記載されている。		
第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名		
次に記載された者は、国際機関において出顧人のために行動する:	✓ 代理人 共通の	代表者
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載;法人は公式の完全な名称を配載;あ	て名は郵便番号及び国名も記載)	電話番号:
弁理士 須藤 克彦 SUTO Katsuhiko	L	0276-30-3151
〒373-0818 日本国群馬県太田市小舞木町38	O UNCIN ZM	ファクシミリ番号:
OK Bilg . 2F, 388, Komaigi-ch		0276-30-3152
Gunma, 373-0818, Japan		加入電信番号:
Bldg.		代理人登録番号:
		る場合は、レ印を付す。

様式PCT/RO/101 (第1用紙) (2001年3月版)

	Д	
M	のを付すこと;少なくとも1つの口にレ印を付すこと)。	
規則 4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う。ほかの租	類の保護又は取扱をいずれかの指定国(又は OAPI)で求	める場合には追記機に記載する。
広域特許		
②AP AR I PO特許: GH	ガーナ Ghana, GMガンピア Gambia, KEケ	= 7 Kenya, LSレソトLesotho,
MWマラウイ Malawi, MZ	モザンビーク Mozambique, S D スーダン Sudan	, S L シエラレオネ Sierra Leone,
S Z スワジランド Swaziland,	「 Z タンザニア United Republic of Tanzania, し	プログラグ Uganda, ZMサンピア Zambia
	アハラレブロトコルと特許協力条約の締約国である。	
には点線上に記載する)		1.2 D 37.4.2.4. 2.D.1
DEA ユーラシア特許:AM	アルメニア Armenia、A Z アゼルバイジャン Azer	Dayan, Branchis of Mallana Branchis & Program
K G キルキスタン Kyrgyzstan,	K Zカザフスタン Kazakhstan, MDモルドバ	Republic of Moldova,R しロン) Russian
	Tajikistan, TMトルクメニスタン Turkmenistan	1、及びユーラシア特許条約と特許助力米減少
締約国である他の国	ナーストリア Austria, B E ベルギーBelgium, F	C Tuttle Pulsonia C H and I I
DEP ヨーロッパ特許:AT	rーストリア Austria, BEヘルキーBeigium, E ritzerland and Liechtenstein, CYキプロスCy	or C 74-7 Crosh Population DE K
スイス及びリピアンジュタインの	enmark, EExxh=r Estonia, ESx.	CySpain FIZZYSYKRinland FF
ツ Germany, D R デンマークレ	ted Kingdom, GRギリシャ Greece, HUペ	ノ Span, T I ノインノンド Finand, I I
ノフンス France, G D 英国 UII	ted Kingdom, GR4997 Greece, F1070 センブルク Luxembourg, MCモナコ Monaco,	NI オランダ Notherlands P Tポルトガル
Postugal P.O. (c==== 7 Post	mia, SEスウェーデンSweden, SIスロベニ	7 Slovenia. S Kスロバキア Slovakia. T F
トルコ Turkov 及びヨーロッパ館	許条約と特許協力条約の締約国である他の国	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DOA OAPI 特許: BFブル	キナファソ Burkina Faso, B Jベナン Benin,	C F 中央アフリカ Central African Republic,
C.G.コンゴ共和国Congo. C.I.	コートジボワール Côte d'Ivoire, C Mカメルーン	Cameroon, GAガボンGabon, GNギニ
Guinea. G Q赤道ギニア Equator	ial Guinea, G Wギニア・ピサウ Guinea-Bissau, N	ALマリ Mali, MRモーリタニア Mauritania
NEニジェール Niger、SNセ	ネガル Senegal、 T D チャド Chad、 T G トー	ゴ Togo,及びアフリカ知的所有権機構のメンパー
国であり特許協力条約の締約国であ	る他の国(他の種類の保護又は取り扱いを求める場	合には点線上に配載する)
国内特許(他の種類の保護又は取り扱いる		
		☑ ○Mオマーン Oman
ZA Eアラブ首長国連邦	図GHガーナGhana	□ PGパプアニューギニア Papua Nev
United Arab Emirates		Guinea
☑A Gアンティグア・バーブーダ	☑ H R クロアチア Croatia	Guinea I P Hフィリピン Philippines
Antigua and Barbuda	☑ H U ハンガリーHungary	TO P 1 7 7 9 C 2 Prinippines
☑ A Lアルパニア Albania		図 P L ポーランド Poland
☑AMアルメニアArmenia	🖸 I Lイスラエル Israel	☑ P Tポルトガル Portugal
☑ A Tオーストリア Austria	. ② I NインドIndia	☑ R Oルーマニア Romania
☑ A Uオーストラリア Australia	. ZIISアイスランドIceland	☑ R Uロシア Russian Federation
☑A Zアゼルパイジャン Azerbaijan	② J P 日本 Japan	図 S Cセーシェル Seychelles
	☑ K E ケニア Kenya	図 S D スーダン Sudan
☑ B A ポスニア・ヘルツェゴピナ Bosni	a 🗵 K G キルギスタン Kyrgyzstan	☑ S E スウェーデン Sweden
and Herzegovina	. ② K P 北朝鮮	☑ S G シンガポール Singapore
☑ B B バルバドス Barbados	Democratic People's Republic of Korea	☑ S Kスロバキア Slovakia
☑ B Gブルガリア Bulgaria	. ZKR韓国Republic of Korea	☑ S L シエラレオネ Sierra Leone
☑ B R ブラジル Brazil		☑ S Y シリア・アラブ Syrian Arab Republi
☑ B Yベラルーシ Belarus		☑ T Jタジキスタン Tajikistan
☑ B Zベリーズ Belize		🗘 T M トルクメニスタン Turkmenistan
図CAカナダ Canada	☑ L R リベリア Liberia	
図CHandL I スイス及びリヒテンシュタイン		☑ T Nテュニジア Tunisia
Switzerland and Liechtenstein	☑ L Tリトアニア Lithuania	☑ T R トルコ Turkey
Z C N中国 China		口 T Tトリニダード・トバゴ
図COコロンピア Colombia		Trinidad and Tobago
Z C R コスタリカ Costa Rica		☑ T Z タンザニア
☑ C U ≯ューハ * Cuba		United Republic of Tanzania
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	☑ U A ウクライナ Ukraine
Z C Z f = 2 Czech Republic		☑ U G ウガンダ Uganda
☑DE ドイツGermany		図US 米国 United States of America
☑ D Kデンマーク Denmark		
☑ DMドミニカ Dominica	共和国 The former Yugoslav Republic of	☑ U Z ウズベキスタン Uzbekistan
②D Z アルジェリア Algeria		□ V Cセントピンセント及びグレナ
図E Cエクアドル Equador	図MNモンゴル Mongolia	ディ・ン 諸島 Saint Vincent and th
② E E エストニア Estonia		Grenadines
☑ E Sスペイン Spain		☑ V Nベトナム Viet Nam
☑ F I フィンランド Finland		☑ Y Uセルピア・モンテネグロ Serbia an
☑ G B 英国 United Kingdom	☑ N I ニカラグア Nicaragua	Montenegro
☑ G D グレナダ Grenada	☑N OノルウェーNorway	図 Z A南アフリカ共和国 South Africa
☑G E グルジア Georgia	. ②N Zニュージーランド New Zealand	- 11m/////

指定の確認の宣言:出題人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。但し、追記機にこの宣言から除く旨の表示をした国は、指定から除かれる。出題人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から 1.5 月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出題人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。(指定の確認は、指定を特定する通知の提出と指定手数料及び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から 1.5 月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

以下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定するためのものである。

☑ Z Mザンピア Zambia

☑ Z Wジンパブエ Zimbabwe......

		2			
		-			1
 	 		 •••	•••	 5

第VI欄 優先権主	报					
以下の先の出願に基づ	く優先権を主張する:					
先の出顧日	先の出願番号		先の出顧			
(日、月、年)		国内出顧:パリ条約同盟国名又は WTO加盟国名	広域出顧: *広域官庁名	国際出願: 受理官庁名		
03.12.02	特願 2002-351187	日本国 Japan				
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
他の優先端の主	<u> </u> 張(先の出願)が追配欄に「	 記載されている。		<u> </u>		
上配の先の出類(ただし、本国原出類の受理官庁に対して出願されたものに限る)のうち、以下のものについて、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁(日本国特許庁の長官)に対して請求する 【 すべて 【 優先権(1) 【 優先権(2) 【 優先権(3) 【 優先権(4) 【 優先権(5) 【 その他は追記欄参照						
*先の出顧がARIPO出願である場合には、当該先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の少なくとも1ヶ国を 表示しなければならない(規則 4.10(b)(ii)):						
第四個 国際調査						
国際調査機関(記載。)						
先の調査結果の 出願H(H.)		査の照会(先の觸査が、国際 出願番号	関査機関によって既に実施 <i>又</i> 国名(又は広城1			
第四欄 申立て						
この出願は以下の申 立 でを含む。(下配の該当する欄をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載) 申立て数						
第V面欄(i) 発明者の特定に関する申立て :						
● 出願し及び特許を与えられる国際出願日における 1 出願人の資格に関する申立て 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
第VII欄(iii)	先の出願の優先権 出願人の資格に関	曜を主張する国際出願日 関する申立て	における :			
✓ 第VEI欄(iv)	発明者である旨の (米国を指定国と		:	1		
第Ⅷ欄(v)	不利にならない開 て	ポスは新規性喪失の例	外に関する申立:			

第四欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て

申立ては実施短別第 212 号に規定する領章文言を使用して作成しなければならない。第個機と同機(i)〜(v)の備考の総論部分、 及び本質に特有の事項について第個機(ii)の備考を参照。この機を使用しないときは、この用紙を顧書に含めないこと。

出顧し及び特許を与えられる国際出顧日における出題人の資格に関する申立で(規則 4.17(iv)に基づく申立てに該当しない場合)(規則 4.17(ii)及び 51 の 2.1(a)(ii)) 本国際出願に関し、

以下の事実により、三洋電機株式会社は、出願しおよび特許を与えられる資格を有している。

26.11.02付けで、 サッチンアガラワル と 三洋電機株式会社 との間に締結された契約 本申し立ては、米国を除くすべての指定国 のためになされたものである。

この申立ての統葉として「第2個(ii)の続き」がある

第四個 (iv) 発明者である旨み中立て(米国を指定国とする場合)

申立ては実施額則解 214 号に規定する以下の領導文官を使用して作成しなければならない。第四額と同題()〜(v)の傭考の総輸部分、 及び本員に怜君の事項について第四題(iv)の傭考を参照。この題を使用しないときは、この用紙を顧書に含めないこと。

発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv)及び 51 の 2.1(a)(iv)) (米国を指定国とする場合) 私は、特許請求の範囲に記載され、かつ特許が求められている対象に関して、自らが最初、最先かつ唯一の発明者である(発明者が1名しか記載 されていない場合)か、あるいは共同発明者である(複数の発明者が記載されている場合)と信じていることを、ここに申し立てる。 本申立ては、本書がその一部をなす国際出願を対象としたものである(出願時に申立てを提出する場合)。 _を対象としたものである (規則 26 の 3 に従って申立てを提出する場合)。 本申立ては、国際出願 PCT/_ 私は、特許請求の範囲を含め、上記国際出願を検討し、かつ内容を理解していることを、ここに表明する。私は、PCT 規則 4.10 の規定に従い、 上記出願の願書において主張する優先権を特定し、かつ、「先の出願」という見出しの下に、出願番号、国名又は世界貿易機関の加盟国名、出願日、 出願月、出願年を記載することで、米国以外の少なくとも一国を指定している PCT 国際出願を含め、優先権を主張する本出願の出願日よりも前の 出願日を有する、米国以外の国で出願された特許又は発明証の出願をすべて特定している。 先の出題: 私は、連邦規則法典第 37 編規則 1.56 (37 C.F.R. § 1.56) に定義された特許性に関し重要であると知った情報について開示義務があることを、こ こに承認する。さらに、一部継続出題である場合、先の出題の日から一部継続出顧の PCT 国際出顧日までの間に入手可能になった重要な情報につ いて開示義務があることを承認する。 私は、 表明された私自身の知識に基づく陳述が真実であり、かつ情報と信念に関する陳述が真実であると信じることをここに申し立てる。 さらに、 故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典第 18 編第 1001 条に基づき、罰金、拘禁、又はその両方により処罰され、またそのような故意によ る虚偽の陳述は、本出願又はそれに対して与えられるいかなる特許についても、その有効性を危うくすることを理解した上で陳述が行われたことを、 ここに申し立てる。 氏名: サッチン アガラワル Sachin Aggarwal NOIDA, India (都市名、米国の州名 (該当する場合) 又は国名) 郵便のあて名: 66C, Block - D, Sector-53, Kanchanjunga Apartments, **NOIDA(UTTAR PRADESH) PIN: 201303** _{国籍:} インド国 India 11.03 28. 日付: 発明者の署名: (国際出願の顧書に発明者の署名がない場合や、規則26の3に基づい (国際出願の願書に発明者の署名がない場合や、規則26の3に基づい て国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合。署名は代 て国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合) 理人ではなく、発明者のものでなければならない。) 氏名: _ (都市名、米国の州名 (該当する場合) 又は国名) 郵便のあて名: 国籍: -発明者の署名: 日付: (国際出願の顧書に発明者の署名がない場合や、規則26の8に基づい (国際出願の顧客に発明者の署名がない場合や、規則26の8に基づい て国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合) て国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合。署名は代 理人ではなく、発明者のものでなければならない。) この申立ての続葉として「第Vii欄(iv)の続き」がある

6			密

第1X欄 照合欄;出願の言語		
この国際出願は次のものを含む。 (a) 郵形式での枚数	この国際出願には、以下にチェックしたものが挙付されている。	—————————————————————————————————————
順番(申立てを含む)	1. 🗸 手数科計算用紙	. 1
明却書(配列表または配列表 に関連する表を除く)… 14 枚	→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	. 1
請求の範囲······ 2 枚	■ 国際事務局の口座への振込を証明する書面	: <u></u> :. 1
要約45 1 枚	2. ✓ 個別の委任状の原本	: 2
図面	3. 包括委任状の原本	: <u></u>
小 計 枚		:
配列去	4 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号)	:
配列表に関連する表 枚	5.	:
(いずれら、転形式での出願の場合はその枚数 コンピュータ数み取り可能な形式の有無を問わない。	6 優先権書類(上記第 棚の()の番号を記載する):	·
下配(C)参照) 会 計 34 枚	7. 国際出顧の翻訳文(翻訳に使用した言語名を記載する):	 :
	8. 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面	:
(実施和則第 801 号(a)(i))	9. コンピュータ読み取り可能な配列表 (媒体の種類と枚数も表示する)	
(i) 配列表 (ii) 配列表に関連する表	(i) 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写し (国際出版の一部を構成しない)	:
(C) コンピュータ酸み取り可能な形式と同一の	(注機のの)又は(C/の)にレ印を付した場合のみ) 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し	:
(実施相則第 801 号(a)(ii))	(iii) 国際関査のための写しの同一性、又は左欄に記載した配列表を含む写 一性についての陳述書を添付	しの同 :
(i) 配列表 (ii) 配列表に関連する表	10. コンピュータ読み取り可能な配列表に関連する表(媒体の種類と枚数も表示する)	:
媒体の種類 (フレキシプカテ゚(スタ、CD-ROM、CD-R、その他)	(i) 実施細則第802 号 b の 4 に基づき提出する国際関査のための写し (国際出願の一部を構成しない)	:
と枚数 配列表	(ii) (左側(b)(ii)又は(C)(ii)にレ印を付した場合のみ) 実施練則第 802 号 b の 4 に基づき機出する国際関査のための写しを含む	r追加的写し :
配列表に関連する表	(jjj) 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に配載した、配列会に関連を含む写しの同一性についての陳述書を添付	した表
(追加的写しは右覆9. (ii)または 10(ii)に記載)	11. その他(書類名を具体的に記載):	
要約書とともに提示する図面:	本国際出願の首語:	
第X欄 出願人、代理人又は共通の代表を人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。	受者の記名押印	
須藤 克彦	· .	
	— 受理官庁記入欄 —	図面
1. 国際出顧として提出された書類の実際の受理の日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	受理された
3. 国際出願として提出された書類を補完する書面又は図	I -	_
その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(訂正日)		
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間	内の受理の日	
5. 出顧人により特定された 国際関金機関 I S A /	6. 関査手数料未払いにつき、国際調査機関に 関査用写しを送付していない。	
	- 国際事務局記入欄	
紀 録原本の受理の日:		



紙は、国際出願の一部を構成	校せず、国際出顧の用紙の枚数に算 り				
P C T					
手数料計算用紙					
手数料計算用紙	国際出顧番号				
出願人又は代理人の書類記号					
F1030736WO00	受理官庁の日付印				
出顧人					
三洋電機株式会社	ii e				
所定の手数料の計算					
1. 及び2. 特許協力条約に基づく国際出顧に関する法律(国内法) 第18条第1項第1号の規定による手数料(注1) (送付手数料(T)及び調査手数料(S)の合計)	90,000 FI T+S				
3. 国際手数料 (注2)					
基本手数科 国際出願に含まれる用紙の枚数 <u>34</u> 枚					
\	4,000 В ы				
b2 4 x 1,200 = 4,800 円 b2					
追加的部分 (明細音の一部がコンピュータ競み取り可能な形式のみの場合 (第 801 号(a)(ii) 又はコンピュータ酸み取り可能な形式と 無形式の両力である場合 (第 801 号(a)(ii))					
400 × <u>用紙一枚の手数料</u> =	Р Б 8				
b1, b2 及びb3 に記入した金額を加算し、合計額を B に記入	58,800 M B				
指定手数料 国際出願に含まれる指定数 97					
(注3) 5 1 支払うべき指定手数針 1 指定当たりの手数料 =	58,000 PI D				
の数 (上限は 5) (注 4) (円)					
B 及び D に配入した金額を加算し、合計額を I に配入	116,800 F I				
4 幼児ナマネエ際虹の入科					
4. 納付すべき手数料の合計 T+S 及び I に配入した金額を加算し、総額を合計に配入	206,800 ₱				
	☆ 8t				
(注1) 送付手数料及び調査手数料については、合計金額を特許印紙をもって着	かしなければならない。				

- (注2) 国際手数料については、受理官庁である日本国特許庁の長官が告示する国際事務局の口座へ振込みを証明する書面 を提出することにより納付しなければならない。
- (注3) 顧書第V欄でレ印を配した口の数。
- (注4) 指定数を記入する。ただし、5指定以上は一律5とする。

明 細 書

回路レイアウト構造

技術分野

本発明は、回路レイアウト構造に関し、例えばカレントミラー回路や差動アンプのようにトランジスタペアを有した回路において、トランジスタペアのマッチング特性を向上させた回路レイアウト構造に関する。

背景技術

トランジスタ間の精密なマッチングは、カレントミラー回路や差動アンプの構成にとって重要である。特に、この精密なマッチングは、低オフセットのオペアンプを得るための助けとなる。第7図は差動ゲイン段を示す回路図である。一対のMOSトランジスタM3、M4がカレントミラー回路10を形成しており、もう一対のMOSトランジスタM1、M2が差動入力ペア11を構成しており、それぞれの一対のMOSトランジスタは精密にマッチングすることが要求される。

カレントミラー回路10を構成するための最も基本的なレイアウトスキームは、 横型レイアウトスキーム (Lateral Layout Scheme) である。これよりも優れた 選択肢は、共通中心点型レイアウトスキーム (Common-Centroid Layout Scheme) である。これらのレイアウトスキーム及び4セグメント型レイアウトス キーム (Four-Segment Layout Scheme) と呼ばれるスキームは以下に掲げる文 献に記載されている。

マオーフェング ラン, アニルクマル タミネディ及びランダール ガイア 「マッチング特性向上のためのカレントミラーレイアウト戦略」アナログ インテグレーテッド サーキッツ アンド シグナル プロセッシング 第28巻、

9-26頁、2001年7月

(Mao-Feng Lan, Anikumar Tammineedi and Randall Geiger, "Current Mirror Layout Strategies for Enhanced Matching Performance", Analog Integrated Circuits and Siganl Processing, Vol28, PP.9-26, July 2001)

以下、これらの従来のレイアウトスキームについて説明する。第8図は、共通中心点型レイアウトスキームを示す図である。第9図は第8図の等価回路を示す図である。M1、M2はマッチングがとられるべきMOS電界効果型トランジスタである。トランジスタM1はサブトランジスタMS11及びMS21に分割され、同様にトランジスタM2はサブトランジスタMS21及びMS22に分割されている。

第8図に示すようこれらのサブトランジスタは共通の中心点Pを有するため、 共通中心点型レイアウトスキームと呼ばれている。また、第9図に示すように、 サブトランジスタMS11及びMS21のゲート、ドレイン及びソースは共通に 接続されてトランジスタM1を構成し、同様に、サブトランジスタMS21及び M2S2のゲート、ドレイン及びソースは共通に接続されてトランジスタM2を 構成している。

ところで、以下に掲げるトランジスタのマッチングに関する文献及びプロセス に依存したレイアウト構造を参照すると、様々なレイアウトのトランジスタがモ デル化されている。

エミ・ジェイ・エム ペルグロム, エー・シー・ジェイ ドウインマイジェル及びエー・ピー・ジー ウェルバース「MOSトランジスタのマッチング特性」 アイ・イー・イー・イー ジェイ・エス・エス・シー SC-24巻、1433 -1439頁、1989年

(M.J.M. Pelgrom, A.C.J.Duinmaijer and A.P.G. Welbers,"Matching properties of MOS transistors"IEEE JSSC, Vol. sc-24, PP. 1433-1439, 1989.

そのようなデバイスの等価的なしきい値電圧は同文献によれば次式で与えられる。

$$V_{Teq} = \frac{\iint V_T(x, y) dxdy}{Active Area}$$

ここで、 $Active\ Area\$ とはサブトランジスタの活性化領域、つまり電流が流れるチャネル領域を意味している。 V_{T} (x,y) はx,y 座標に依存した局所的なしきい値電圧であり、これを活性化領域に互って面積分してその平均値を求めている。

また、しきい値電圧はプロセス上の理由からウエハーの面内で場所によって変化しており、このしきい値電圧の変化を、第8図中に示す原点Oからの勾配振幅 $(gradient\ amplitude)$ α 及び勾配方位角 $(gradient\ direction)$ θ を導入することでモデル化することができる。

そこで、このようなしきい値電圧モデルを上記のサブトランジスタMS $1\ 1$, MS $1\ 2$, MS $2\ 1$, MS $2\ 2$ に適用してそれぞれに対応するしきい値 $V_{T\ 1\ 2}$, $V_{T\ 2\ 1}$, $V_{T\ 2\ 2}$ を求めることができる。

まず、サブトランジスタMS11のしきい値 V_{T11} については次式で与えられる。

$$WS11: V_{T11} = \frac{\int_{(L_S + d_2)}^{(2L_S + d_2)} \int_{W_S + d_1)}^{(2L_S + d_2)} \left[V_T + (L_S \alpha \sin \theta) + (W_S \alpha \cos \theta) \right] \times [dW] \times [dL]}{W_S \times L_S}$$

$$V_{T11} = \frac{\int_{(L_S + d_2)}^{(2L_S + d_2)} \left[V_T W_S + L_S W_S \alpha \sin \theta + \alpha \cos \theta \left(\frac{(d_1 + 2W_S)^2 - (d_1 + W_S)^2}{2} \right) \right] [dL]}{W_S \times L_S}$$

$$V_{T11} = \frac{\int_{(L_S + d_2)}^{(2L_S + d_2)} \left[V_T W_S + L_S W_S \alpha \sin \theta + \alpha \cos \theta \left(\frac{d_1^2 + 4W_S^2 + 4d_1 W_S - d_1^2 - W_S^2 - 2d_1 W_S}{2} \right) \right] [dL]}{W_S \times L_S}$$

$$V_{T11} = \frac{\int\limits_{(L_S+d_2)}^{(2L_S+d_2)} \left[V_T W_S + L_S W_S \alpha \sin \theta + \alpha \cos \theta \left(\frac{3W_S^2 + 2W_S d_1}{2} \right) \right] [dL]}{W_S \times L_S}$$

$$V_{T11} = \frac{\int\limits_{(L_S+d_2)}^{(2L_S+d_2)} V_T + L_S \alpha \sin \theta + \alpha \cos \theta \left(\frac{3W_S}{2} + d_1\right) \left[dL\right]}{L_S}$$

$$V_{T11} = \frac{\left[V_{T}L_{S} + \alpha \cos \theta \left(\frac{3W_{S}}{2} + d_{1}\right)L_{S} + \alpha \sin \theta \left(\frac{(2L_{S} + d_{2})^{2} - (L_{S} + d_{2})^{2}}{2}\right)\right]}{L_{S}}$$

$$V_{T11} = \frac{\left[V_{T}L_{S} + \alpha \cos \theta \left(\frac{3W_{S}}{2} + d_{1}\right)L_{S} + \alpha \sin \theta \left(\frac{4L_{S}^{2} + d_{2}^{2} + 4L_{S}d_{2} - L_{S}^{2} - d_{2}^{2} - 2L_{S}d_{2}}{2}\right)\right]}{L_{S}}$$

$$V_{T11} = \frac{\left[V_T L_S + \alpha \cos \theta \left(\frac{3W_S}{2} + d_1\right) L_S + \alpha \sin \theta \left(\frac{3L_S^2 + 2L_S d_2}{2}\right)\right]}{L_S}$$

$$V_{T11} = V_T + \alpha \left(\frac{3W_S}{2} + d_1\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{3L_S}{2} + d_2\right) \sin\theta$$

同様にして、サブトランジスタMS12のしきい値 $V_{\tau 1 2}$ については次式で与えられる。

MS12:
$$V_{T12} = V_T + \frac{W_S}{2} \alpha \cos \theta + \frac{L_S}{2} \alpha \sin \theta$$

同様にして、サプトランジスタMS21のしきい値Vェ21については次式で与

えられる。

MS21:
$$V_{T21} = V_T + \alpha \left(\frac{3W_S}{2} + d_1 \right) \cos \theta + \frac{L_S}{2} \alpha \sin \theta$$

同様にして、サブトランジスタMS22のしきい値 V_{T22}については次式で与 えられる。

MS22:
$$V_{T22} = V_T + \frac{W_S}{2} \alpha \cos \theta + \alpha \left(\frac{3L_S}{2} + d_2 \right) \sin \theta$$

上述の数式において、d1は隣接するサブトランジスタのドレイン(ソース)間の距離、d2は隣接するサブトランジスタ間のゲート間の距離、Wsはサブトランジスタのゲート長である。

次に、第10図は、4セグメント型レイアウトスキームを示す図である。第1 1図は第10図の等価回路を示す図である。M1, M2はマッチングがとられるべきMOS電界効果型トランジスタである。トランジスタM1はサブトランジスタMS11, MS12, MS13及びMS14に分割され、これらのサブトランジスタは4つのセグメントに配置されている。

同様に、トランジスタM2はサブトランジスタMS21, MS22, MS23 及びMS24に分割され、これらのサブトランジスタは4つのセグメントに配置 されている。

この4セグメントレイアウトスキームについても第10図中に示すように、原点O、勾配振幅 α 及び勾配方位角 θ が定義され、しきい値のモデリング結果を記述する以下の式が得られる。すなわち、以下の式においてサブトランジスタMS 1 1 のしきい値を $V_{T\,1\,1}$ 、サブトランジスタMS 1 2 のしきい値を $V_{T\,1\,2}$ 、サブトランジスタMS 1 3 のしきい値を $V_{T\,1\,3}$ 、サブトランジスタMS 1 4 のしきい値を $V_{T\,1\,4}$ 、サブトランジスタMS 1 1 のしきい値を $V_{T\,2\,3}$ 、サブトランジスタMS 1 2 のしきい値を10 のしきい値を11 のしきい値を12 のしきい値を13 のしきい値を14 のしきい値を15 のしきい値を16 のしきい値を17 のしきい値を18 のしきい値を19 のしきい値を19 のしきい値を11 のしきい値を11 のしきい値を11 のしきい値を12 のしきい値を13 のしきい値を13 のしきい値を14 のしきい値を15 のしきい値を16 のしきい値を17 のしきい値を18 のしきい値を19 のしきい

サプトランジスタMS24のしきい値をV_{T24}とする。

MS11:
$$V_{T11} = V_T - \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2} \right) \cos \theta + \alpha \left(\frac{L}{2} + W + \frac{3d_1}{2} \right) \sin \theta$$

MS12:
$$V_{T12} = V_T + \alpha \left(W + \frac{L}{2} + \frac{3d_1}{2}\right)\cos\theta + \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2}\right)\sin\theta$$

MS13:
$$V_{T13} = V_T + \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2} \right) \cos \theta - \alpha \left(\frac{L}{2} + W + \frac{3d_1}{2} \right) \sin \theta$$

MS14:
$$V_{T14} = V_T - \alpha \left(W + \frac{L}{2} + \frac{3d_1}{2}\right) \cos\theta - \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2}\right) \sin\theta$$

MS21:
$$V_{T21} = V_T + \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2}\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{L}{2} + W + \frac{3d_1}{2}\right) \sin\theta$$

MS22:
$$V_{T22} = V_T + \alpha \left(W + \frac{L}{2} + \frac{3d_1}{2}\right) \cos\theta - \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2}\right) \sin\theta$$

MS23:
$$V_{T23} = V_T - \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2}\right) \cos\theta - \alpha \left(\frac{L}{2} + W + \frac{3d_1}{2}\right) \sin\theta$$

MS24:
$$V_{T24} = V_T - \alpha \left(W + \frac{L}{2} + \frac{3d_1}{2}\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{W}{2} + \frac{d_1}{2}\right) \sin\theta$$

上述の数式において、 d 1 は隣接するサプトランジスタのドレイン(ソース)間の距離、 W_s はサプトランジスタのゲート幅、 L_s はサプトランジスタのゲート 長である。

発明の開示

上述した4セグメント型レイアウトスキームは、中心点型レイアウトスキームに比して優れたマッチング特性を発揮することができる。しかしながら、4セグメント型レイアウトスキームは大きなパターン面積を必要とするという欠点があ

った。

そこで、本発明の回路レイアウト構造は、精密なマッチングが要求される一 対のトランジスタ第1図に示すように、4行4列のマトリクスに配置されたサ ブトランジスタに分割し、それぞれ4つのサブトランジスタから成る4つのセ ルを構成し、各セルに属するサブトランジスタが共通の中心点を有するように したレイアウト構造である。

これにより、一対のトランジスタのマッチングは4セグメント型レイアウトスキームのそれと同程度に優れ、しかもパターン面積が小さいレイアウト構造を実現することができる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施形態に係るマルチプル共通中心点型のレイアウト構造を示す平面図であり、第2図は本発明の実施形態に係るマルチプル共通中心点型のレイアウト構造の等価回路図であり、第3図は本発明の実施形態に係るマルチプル共通中心点型のレイアウト構造の概念図であり、第4図は各種のレイアウトのシミュレーションに用いた回路の回路図であり、第5図はHSPICEを用いたシミュレーションの結果を示す図であり、第6図はHSPICEを用いたシミュレーションの結果を示す図であり、第7図は差動ゲイン段を示す回路図であり、第8図は共通中心点型レイアウトスキームを示す平面図であり、第9図は共通中心点型レイアウトスキームを示す平面図であり、第10図は4セグメント型レイアウトスキームを示す平面図であり、第11回は4セグメント型レイアウトスキームを示す平面図であり、第11回は4セグメント型レイアウトスキームを示す平面図であり、第11回は4セグメント型レイアウトスキームを示す平面図であり、第11回は4セグメント型レイアウトスキームの等価回路図である。

発明を実施するための最良の形態

次に本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。第1図は

マルチプル共通中心点型のレイアウト構造(Multiple・Common・Centroid layout configuration)を示す図であり、第2図は第1図の等価回路を示す図である。 M 1 , M 2 はマッチングがとられるべきMOS電界効果型トランジスタである。 メイントランジスタである第1のトランジスタM1は8個のサブトランジスタMS 11, MS12, MS13, MS14, MS15, MS16, MS17, MS18に分割されている。これらのサブトランジスタはゲート、ドレイン及びソースは共通に接続され、第1のトランジスタM1を形成している。

また、同様に、メイントランジスタである第2のトランジスタM2も8個のサプトランジスタMS21、MS22、MS23、MS24、MS25、MS26、MS27、MS28に分割されている。そして、これらのサブトランジスタはゲート、ドレイン及びソースは共通に接続され、第2のトランジスタM2を形成している。

第1のトランジスタM1と第2のトランジスタM2とで差動アンプの差動入力ペアトランジスタを構成することができる。また、第1のトランジスタM1と第2のトランジスタM2とでカレントミラーを構成する場合には、それぞれのサブトランジスタのゲート同士を共通に接続すれば良い。

第1及び第2のトランジスタM1,M2を構成している上記の16個のサブトランジスタは、全体として見ると4行4列のマトリクスに配置されている。このマトリクスは4つのセルから構成されている。第1のセルC1は、サブトランジスタMS11,MS12、サブトランジスタMS21,MS22によって構成されている。

第2のセルC 2 は、サブトランジスタM S 1 3 、M S 1 4 、サブトランジスタ M S 2 3 、M S 2 4 によって構成されている。第3のセルC 3 は、サブトランジスタM S 1 5 、M S 1 6 、サブトランジスタM S 2 5 、M S 2 6 によって構成されている。第4のセルC 4 は、サブトランジスタM S 1 7 、M S 1 8 、サブトラ

ンジスタMS27、MS28によって構成されている。

第1のセルC1について詳細に説明すると、第1行第1列にサブトランジスタMS21、第2行第2列にサブトランジスタMS22が配置され、第1行第2列にサブトランジスタMS11、第2行第1列にサブトランジスタMS12が配置されおり、これらのサブトランジスタは共通の中心点P1を有している。

これらのサブトランジスタは列方向にソースドレインが平行に配置され、行方向にゲートが平行に配置されている。そして、第2のセルC2、第3のセルC3、第4のセルC4は第1のセルC1を基に対称配置により構成されている。これらの第2のセルC2、第3のセルC3、第4のセルC4はそれぞれの共通の中心点P2、P3、P4を有している。

第3図はその対称配置の概念をわかりやすく説明したレイアウト図である。図において、第1のトランジスタM1を構成するサブトランジスタに「1」の符号を付し、第2のトランジスタM2を構成するサブトランジスタに「2」の符号を付している。この図からわかるように、第2のセルC2は第1のセルC1を対称線MR1に対して線対称(ミラー対称)に配置することで得られる。また、第3のセルC3は第1のセルC1を対称線MR2に対して線対称に配置することで得られる。第4のセルC4は第2のセルC2を対称線MR2に対して線対称に配置することで得られる。

こうして、第1のトランジスタM1及び第2のトランジスタM2の回路レイアウト構造が得られる。これを1つのマクロセルMC1とすると、このマクロセルMC1を基に、対称線MR3に対して線対称なマクロセルMC2が得られる。そして、更にマクロセルMC1,MC2を基に、対称線MR4に対して線対称なマクロセルMC3,MC4を得ることができる。

更に、マクロセルMC1, MC2, MC3, MC4を対称線MR5に対して線 対称に配置して不図示のマクロセルを構成することができる。このような対称配 置を繰り返すことによりマクロセルを無限に増やすことができる。

次に、前述したしきい値電圧モデルを上記の16個のサブトランジスタに適用 すると、各サブトランジスタのしきい値は以下の式で与えられる。第1図におい て、原点O、勾配振幅α及び勾配方位角θが定義されている。

MS11:
$$V_{T11} = V_T + \alpha \left(\frac{3W_S}{2} + d_1 \right) \cos \theta + \alpha \left(\frac{7L_S}{2} + 2d_2 + d_3 \right) \sin \theta$$

MS12:
$$V_{T12} = V_T + \frac{W_S}{2}\alpha\cos\theta + \alpha\left(\frac{5L_S}{2} + d_2 + d_3\right)\sin\theta$$

MS13:
$$V_{T13} = V_T + \alpha \left(\frac{5W_S}{2} + 2d_1 \right) \cos \theta + \alpha \left(\frac{7L_S}{2} + 2d_2 + d_3 \right) \sin \theta$$

MS14:
$$V_{T14} = V_T + \alpha \left(\frac{7W_S}{2} + 3d_1 \right) \cos \theta + \alpha \left(\frac{5L_S}{2} + d_2 + d_3 \right) \sin \theta$$

MS15:
$$V_{T15} = V_T + \frac{W_S}{2} \alpha \cos \theta + \alpha \left(\frac{3L_S}{2} + d_2\right) \sin \theta$$

MS16:
$$V_{T16} = V_T + \alpha \left(\frac{3W_S}{2} + d_1 \right) \cos \theta + \frac{L_S}{2} \alpha \sin \theta$$

MS17:
$$V_{T17} = V_T + \alpha \left(\frac{7W_S}{2} + 3d_1\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{3L_S}{2} + d_2\right) \sin\theta$$

MS18:
$$V_{T18} = V_T + \alpha \left(\frac{5W_S}{2} + 2d_1 \right) \cos\theta + \frac{L_S}{2} \alpha \sin\theta$$

MS21:
$$V_{T21} = V_T + \frac{W_S}{2} \alpha \cos \theta + \alpha \left(\frac{7L_S}{2} + 2d_2 + d_3 \right) \sin \theta$$

MS22:
$$V_{T22} = V_T + \alpha \left(\frac{3W_S}{2} + d_1\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{5L_S}{2} + d_2 + d_3\right) \sin\theta$$

MS23:
$$V_{r23} = V_r + \alpha \left(\frac{7W_s}{2} + 3d_1\right)\cos\theta + \alpha \left(\frac{7L_s}{2} + 2d_2 + d_3\right)\sin\theta$$

MS24:
$$V_{T24} = V_T + \alpha \left(\frac{5W_S}{2} + 2d_1 \right) \cos \theta + \alpha \left(\frac{5L_S}{2} + d_2 + d_3 \right) \sin \theta$$

MS25:
$$V_{T25} = V_T + \alpha \left(\frac{3W_S}{2} + d_1\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{3L_S}{2} + d_2\right) \sin\theta$$

MS26:
$$V_{T26} = V_T + \frac{W_S}{2} \alpha \cos \theta + \frac{L_S}{2} \alpha \sin \theta$$

MS27:
$$V_{T27} = V_T + \alpha \left(\frac{5W_S}{2} + 2d_1\right) \cos\theta + \alpha \left(\frac{3L_S}{2} + d_2\right) \sin\theta$$

MS28:
$$V_{T28} = V_T + \alpha \left(\frac{7W_S}{2} + 3d_1 \right) \cos \theta + \frac{L_S}{2} \alpha \sin \theta$$

上述した数式において、d 1 は隣接するサブトランジスタのドレイン (ソース)間の距離、d 2, d 3 は隣接するサブトランジスタ間のゲート間の距離、 W_s はサブトランジスタのゲート幅、 L_s はサブトランジスタのゲート長である。

次に、HSPICEを用いたシミュレーションについて説明する。このシミュレーションの目的は、勾配方位角 θ の変化に対して、各種のトランジスターマッチング・レイアウトがどのような特性を示すかをチェックすることである。すべてのシミュレーションに共通なパラメータは、d 1 = d 2 = d 3

 $4 \mu m$, $\alpha = 0$. $5 m V / \mu m$, $V_T = 0$. 7 V σ b δ.

第4図はシミュレーションに用いた回路の回路図を示す。メイントランジスタである第1のトランジスタM1はN個のサブトランジスタMS11~MS1Nから構成され、これらのゲートに共通にバイアス電圧V_Bが印加されている。また、サブトランジスタMS11~MS1Nの共通のドレインD1は抵抗Rを通して高い電源Vddが印加されている。またサブトランジスタMS11~MS1Nの共

诵のソースS1は低い電源Vssが印加されている。

また、メイントランジスタである第2のトランジスタM2はN個のサブトラン ジスタMS21~MS2Nから構成され、これらのゲートに共通にバイアス電圧 V_Bが印加されている。また、サブトランジスタMS21~MS2Nの共通のド レインD2は抵抗Rを通して高い電源Vddが印加されている。またサプトラン ジスタMS21~MS2Nの共通のソースS2は低い電源Vssが印加されてい る。

ここで、すべてのシミュレーションの実行に対して、百分率ミスマッチ (Percentage Mismatch)を次式によって定義する。

百分率ミスマッチ(Percentage Mismatch) =
$$\frac{I_{M2} - I_{M1}}{I_{M1}} \times 100$$

ここで、I_{M1}は第1のトランジスタM1を流れる電流、I_{M2}は第2のトラン ジスタM2を流れる電流である。異なるトランジスターマッチング・レイアウト の特性を比較するために2セットのシミュレーションを行った。第1セットでは、 サプトランジスタのサイズが全てのレイアウトスキームについて、 $W_s = 1$ 0 μm、 L_s=10µmに設定されている。

すると、各種のレイアウトスキームの幅W及び長さしは以下の通りである。

共通中心型レイアウト:

 $W = 20 \mu m$

 $L = 10 \mu m$

4 セグメント型レイアウト:

 $W = 4 \ 0 \ \mu m$ $L = 1 \ 0 \ \mu m$

マルチプル共通中心点型レイアウト: W=80μm

 $L = 10 \mu m$

第5図はこの第1セットのシミュレーション結果を示す図である。横軸は勾配 方位角 θ、縦軸は百分率ミスマッチ (%) を示している。この結果から明らかな ように、本発明のマルチプル共通中心点型レイアウトは共通中心点型レイアウト に匹敵するマッチング特性の改善を示している。すなわち、マルチプル共通中心 点型レイアウトの百分率ミスマッチ (%) は、共通中心点型レイアウトのそれよ

り3桁も小さい。

第2セットのシミュレーションは、第1のトランジスタM1及び第2のトラン ジスタM2のサイズが、すべてのレイアウトスキームについて等しいという条件 の下に実行された。すなわち、第1のトランジスタM1及び第2のトランジスタ M2の幅Wは80μm、長さWを10μmとした。すると、各種のレイアウトスキ ームのサブトランジスタの大きさは以下の通りになる。

共通中心型レイアウト:

 $W_s = 4.0 \, \mu m$ $L_s = 1.0 \, \mu m$

4セグメント型レイアウト: $W_s = 20 \mu m$

 $L_s = 10 \mu m$

マルチプル共通中心点型レイアウト: $W_s = 10 \mu m$ $L_s = 10 \mu m$

第6図は第2セットのシミュレーション結果を示す図である。横軸は勾配方位 角 θ、縦軸は百分率ミスマッチ (%) を示している。この結果から明らかなよう に、本発明のマルチプル共通中心点型レイアウトの百分率ミスマッチ(%)は他 のレイアウトのいずれに比較しても改善されている。

また、本発明のマルチプル共通中心点型レイアウトは、4セグメント型レイア ウトに比してレイアウト領域が少ないという特徴を有している。このマルチプル 共通中心点型レイアウトによるマッチング改善効果は、共通中心点型レイアウト に比べて少しだけレイアウト領域を余分に必要とするだけで得ることができる。

次ページの表は、3つの異なるレイアウトスキームの面積を計算する式と、与 えられた1セットのパラメータに対して計算された面積を示している。メイント ランジスタである第1のトランジスタM1及び第2のトランジスタM2の大きさ は、すべてのレイアウトスキームに対して、幅Wは80μm、長さWは10μmで あり、 $d 1 = d 2 = d 3 = 4 \mu m$ である。

共通中心点型レイアウトでは、それぞれのメイントランジスタが2つのサブト ランジスタに分割され、それぞれのサブトランジスタの幅W。は40μm、長さし sは10μmである。4セグメント型レイアウトでは、それぞれのメイントランジ スタが 4 つのサブトランジスタに分割され、それぞれのサブトランジスタの幅 W s は 2 0 μ m、長さ L s は 1 0 μ m である。

本発明のマルチプル共通中心点型レイアウトではそれぞれのメイントランジスタが8つのサブトランジスタに分割され、それぞれのサブトランジスタの幅 W_s は $10\mu m$ 、長さ L_s は $10\mu m$ である。

表

レイアウトタイプ	面積評価式	計算された面積 [W=80μm, L=10μm, d1=d2=d3=4μm]
共通中心点型	(2Ls+d ₂)(2Ws+d ₁)	2.016e-9m ² [Ws=40 μ ,Ls=10 μ]
4セグメント型	(2Ws+2Ls+3d ₁)(2Ws+2Ls+3d ₁)	$5.184e - 9m^{2}$ [Ws=20 μ ,Ls=10 μ]
マルチ共通中心点型	(4Ls+2d ₂ +d ₈)(4Ws+3d ₁)	$2.704e - 9m^{2}$ [Ws=10 μ]

*Lsと Ws はサブトランジスタのサイズを表す

*LとWは全体トランジスタのサイズを表す

上述したように、本発明のマルチプル共通中心点型レイアウトによれば、4セグメント型レイアウトに匹敵するマッチング特性が得られ、しかもレイアウト領域を少なくできるという効果を有する。

特に、本発明のレイアウトをオペアンプの差動トランジスタペアやカレント ミラーを構成するトランジスタペアに適用することにより、低オフセットのオ ペアンプを実現することができる。

請求の範囲

1. 第1及び第2のトランジスタが、4つのサブトランジスタを含む第1のセル、第2のセル、第3のセル及び第4のセルから構成され、全体として4行4列のマトリックスに配置された16個のサブトランジスタから成る回路レイアウト構造であって、

前記第1のセルは、第1行第1列及び第2行第2列に前記第2のトランジスタを構成するサブトランジスタがそれぞれ配置され、第1行第2列及び第2行第1列に前記第1のトランジスタを構成するサブトランジスタがそれぞれ配置され、かつこれらのサブトランジスタは共通の中心点に対して対称に配置されて成り、

前記第2のセルは、前記第1のセルに対して線対称に配置されて成り、

前記第3のセル及び前記第4のセルは、前記第1のセル及び前記第2のセル に対して線対称に配置されて成ることを特徴とする回路レイアウト構造。

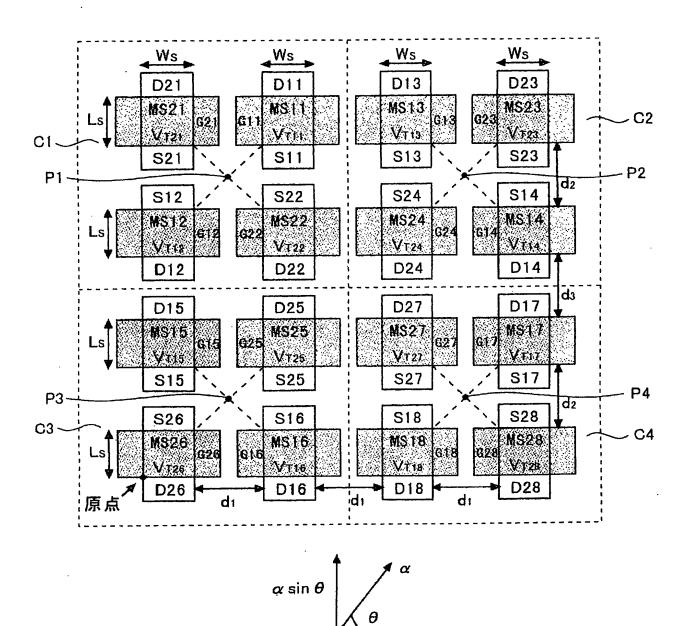
- 2. 前記第1のトランジスタを構成する各サブトランジスタのゲートと前記第2のトランジスタを構成する各サブトランジスタのゲートが共通接続され、前記第1及び第2のトランジスタがカレントミラー回路を構成することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の回路レイアウト構造。
- 3. 前記第1のトランジスタを構成する各サブトランジスタのゲートが共通に接続されて前記第1のトランジスタのゲートを構成し、前記第2のトランジスタを構成する各サブトランジスタのゲートが共通接続されて前記第2のトランジスタのゲートを構成することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の回路レイアウト構造。
- 4. 前記第1及び第2のトランジスタが差動アンプの差動入力ペアトランジスタを構成することを特徴とする請求の範囲第3項に記載の回路レイアウト構造。

- 5. 前記第1のトランジスタを構成する各サブトランジスタのソースが共通接続され、かつ前記第1のトランジスタを構成する各サブトランジスタのドレインが共通接続されたことを特徴とする請求の範囲第1項、第2項、第3項、第4項のいずれかに記載の回路レイアウト構造。
- 6. 前記第2のトランジスタを構成する各サプトランジスタのソースが共通接続され、かつ前記第2のトランジスタを構成する各サプトランジスタのドレインが共通接続されたことを特徴とする請求の範囲第5項に記載の回路レイアウト構造。
- 7. 前記第1のセル、第2のセル、第3のセル及び第4のセルから成る回路が、線対称となるように複数配置されていることを特徴とする請求の範囲第 1項、第2項、第3項、第4項のいずれかに記載の回路レイアウト構造。

要 約 書

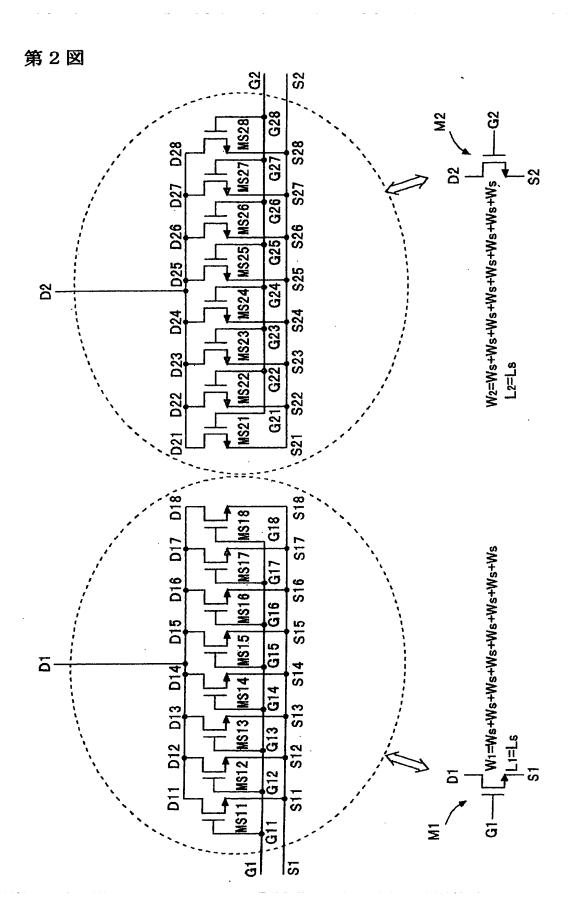
メイントランジスタM1, M2を4行4列のマトリクスに配置されたサブトランジスタに分割し、それぞれ4つのサブトランジスタから成る4つのセルを構成し、各セルに属するサブトランジスタが共通の中心点を有するようにした。これにより、メイントランジスタM1, M2のトランジスタのマッチングは4セグメント型レイアウトスキームのそれと同程度に優れ、しかもパターン面積が小さいレイアウト構造を実現することができる。

第1図

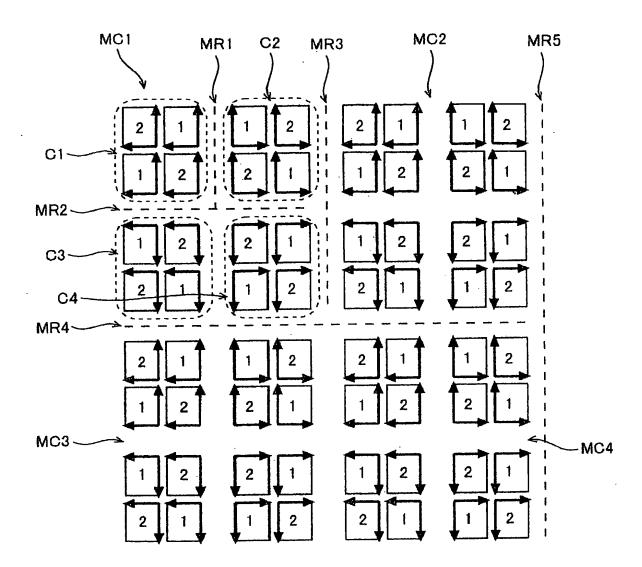


 $\alpha\cos\theta$

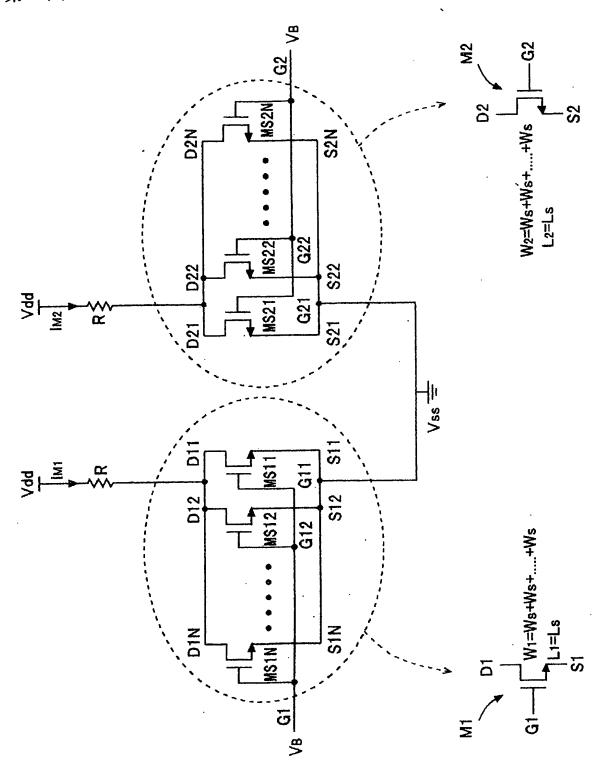
原点



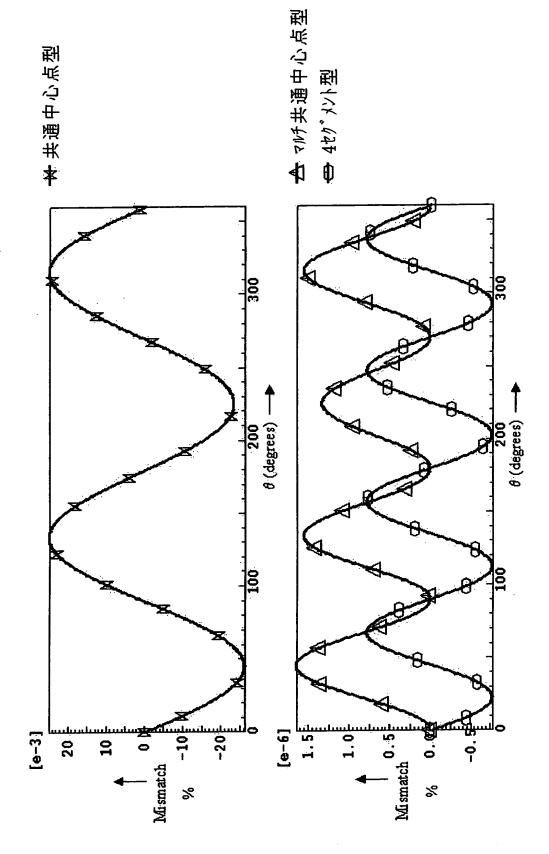
第3図



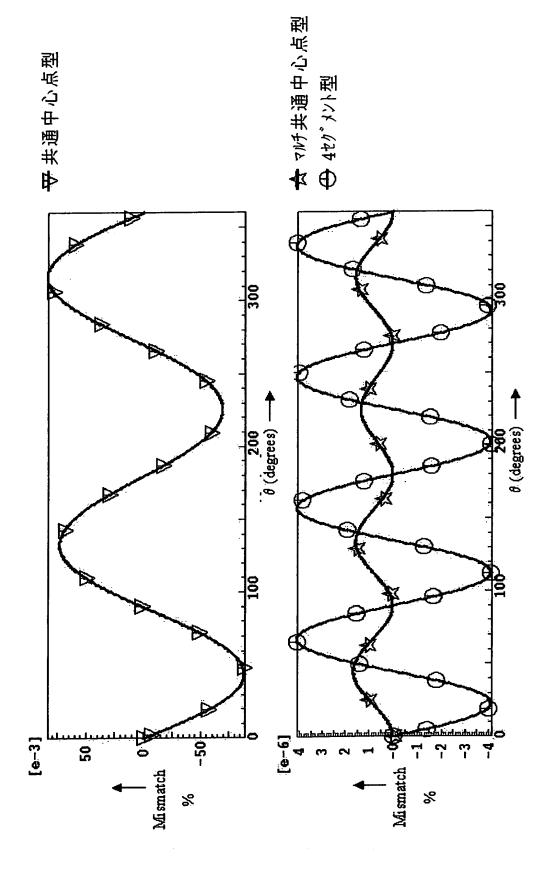
第4図



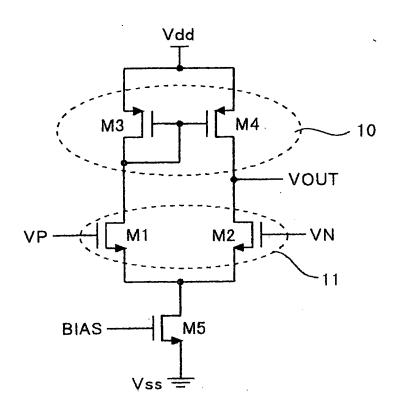




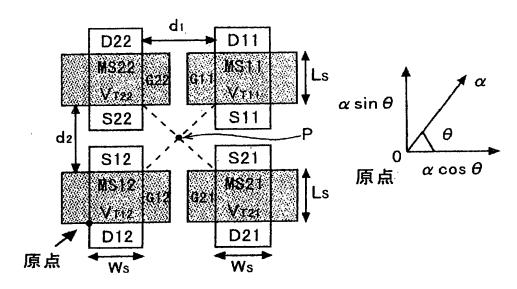




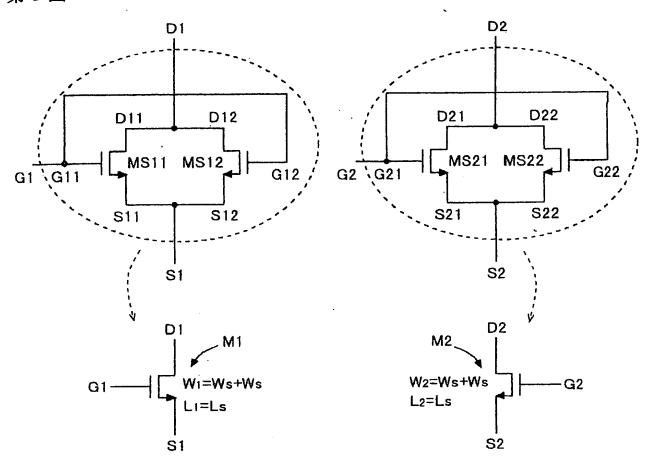
第7図



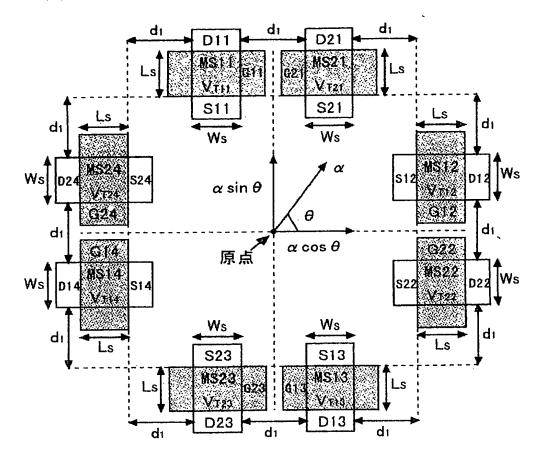
第8図

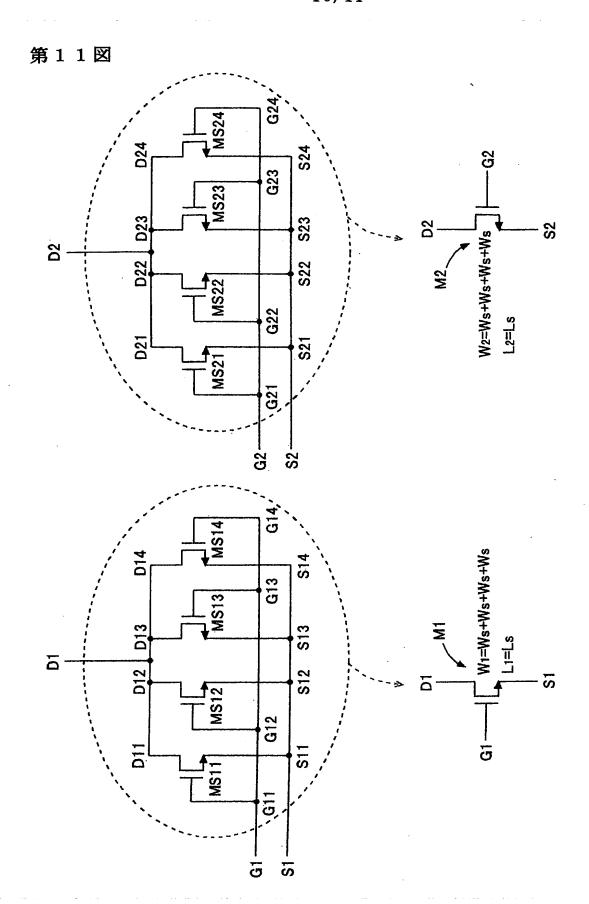


第9図



第10図





M1 第1のトランジスタ

M2 第2のトランジスタ

MS11~MS28 サブトランジスタ

P1, P2, P3, P4 共通の中心点

C1 第1のセル

C2 第2のセル

C3 第3のセル

C4 第4のセル

MC1 マクロセル